

Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik

20.12.2017

Prüfungsamt

Studienrichtung: Mikroelektronik

Prüfungsablaufplan für das WS 17/18

Studienjahrgang 2013 / 9. Semester

in der Prüfungsperiode vom 05.02.2018 - 03.03.2018
(vorbehaltlich weiterer Ergänzungen und Veränderungen)

Prüfungsfach	Prüfungstermin	Prüfer	Ort	Zeit
Wahlpflichtfächer:				
Physikalische Mikroanalytik / Schicht-/HL-Messtechnik 87310 12 12 05 (Modul Char. von Mikrostrukturen)	n. Vereinb.	Prof. Bartha/Prof. Richter	mündlich	n. Vereinb.
OS Mikroelektronik - Referat 92110 12 12 08	n. Vereinb.	Prof. Bartha / Prof. Richter		n. Vereinb.
OS Mikroelektronik - Beleg 92120 12 12 08	n. Vereinb.	Prof. Bartha / Prof. Richter		n. Vereinb.
Solarenergietechnik / Dünne Schichten / Vakuum 86110 12 12 03 (Modul Ang. Dünnschicht- und Solartechnik)	n. Vereinb. SS	Prof. Bartha	mündlich	n. Vereinb.
VLSI-Prozessorentwurf - Projektarbeit 78110 12 08 19	n. Vereinb.	Prof. Mayr		
VLSI-Prozessorentwurf - Referat 78120 12 08 19	n. Vereinb.	Prof. Mayr		
Sensorik II / Biochem. Sensoren / IR-Messt. - Prüfung 86910 12 11 04 (Modul Sensoren und Sensorsysteme)	07.02.	Prof. Gerlach/Dr. Günther	schriftlich GÖR/229/U	90 Min. 2. DS
Sensorik II / Biochem. Sensoren / IR-Messt.- Laborpraktikum 86930 12 11 04 (Modul Sensoren und Sensorsysteme)	n. Vereinb.	Prof. Gerlach/Dr. Günther		
Plasmatechnik 87110 12 11 05	16.02.	Prof. Gerlach	schriftlich GÖR/127/U	90 Min. 3. DS
Unkonv. Aktoren / Mikrofluidik - Prüfung 87510 12 12 06 (Modul Neue Aktoren und Aktorsysteme)	n. Vereinb.	Prof. Richter	mündlich 30 od. schriftlich 90 Min.	n. Vereinb.
Unkonv. Aktoren / Mikrofluidik - Referat 87520 12 12 06 (Modul Neue Aktoren und Aktorsysteme)	n. Vereinb.	Prof. Richter		n. Vereinb.
Unkonv. Aktoren / Mikrofluidik - Laborpraktikum 87530 12 12 06 (Modul Neue Aktoren und Aktorsysteme)	n. Vereinb.	Prof. Richter		n. Vereinb.
Innovative Konzepte für aktive Bauelemente der Nanoelektronik - Prüfung Innov. Semiconductor Devices 87750 12 12 07	n. Vereinb.	Prof. Mikolajick	schriftlich od. mdl.	90 Min.
Innovative Konzepte für aktive Bauelemente der Nanoelektronik - Prüfung Materials for Nanoelectronics 87740 12 12 07	n. Vereinb.	Prof. Richter	schriftlich od. mdl.	90 Min.
Innovative Konzepte für aktive Bauelemente der Nanoelektronik - Beleg (Protokolle) 87760 12 12 07	n. Vereinb.	Prof. Richter	mündlich	n. Vereinb.
Speichertechnologie 86320 12 12 04	n. Vereinb.	Prof. Mikolajick	schriftlich od. mdl.	90 Min.
Modellierung und Charakterisierung nanoelektronischer Bauelemente (Klausur) 155310 12 08 26	14.02.	Prof. Schröter	schriftlich GÖR/226/H	n. Vereinb. 4. DS
Charakterisierung und Modellierung nanoelektronischer Bauelemente (Belegarbeit) 155320 12 08 26	n. Vereinb.	Prof. Schröter		
OS Mikro-Nanoelektronik 12 08 25 Referat 92510	n. Vereinb.	Prof. Schröter		
OS Mikro-Nanoelektronik 12 08 25 Beleg 92520	n. Vereinb.	Prof. Schröter		

Nach- und Wiederholungsprüfungen				
Theor. Elektrotechnik II 31020 11210 (05)	28.02.	Dr. Jacobs Prof. Krauthäuser	POT/81/H	120 Min. 1./2. DS
Theor. Elektrodynamik (Master) 31030	28.02.	Dr. Jacobs Prof. Krauthäuser	POT/81/H	1./2. DS
Physik ausgew. Bauelemente (Num. Bauelementesim. + Modellierung für den Schaltungsentwurf) 49610	08.02.	Prof. Schröter	schriftlich BAR/218/U	150 Min. 4./5. DS
Mikrosystem- und Halbleitertechnologie (Mikrosysteme, Werkstoffe, HL-Technologie, Sensorik) Prüfung 1 49010 (MST/Sensor.) Prüfung 2 49020 (Werkst./HLT)	 mündlich n. Vereinb. SS 18	Prof. Richter/Prof. Gerlach/Prof. Bartha Prof. Richter Prof. Richter/Prof. Gerlach	 n. Vereinb.	 n. Vereinb.
Schaltkreis- und Systementwurf (Beleg) 49810	n. Vereinb.	Prof. Mayr		

(05)

PO-Version

Prof. Dr.-Ing. St. Bernet
Vorsitzender des Prüfungsausschusses